



PATENTANWÄLTE
GULDE HENGELHAUPT ZIEBIG

European Patent and Trademark Attorneys
Patente Marken Design Lizenzen

GULDE HENGELHAUPT ZIEBIG Schützenstraße 15-17, 10117 Berlin

Anmelder:

LayTec Gesellschaft für in-situ
und Nano-Sensorik
Hardenbergstr. 36
10623 Berlin

Klaus W. Gulde, Dipl.-Chem.
Jürgen D. Hengelhaupt, Dipl.-Ing.*
Dr. Marlene K. Ziebig, Dipl.-Chem.**
Wilfried H. Goesch, Dipl.-Ing.*

Schützenstraße 15-17
D-10117 Berlin

Tel: 030/264 13 30
Fax: 030/264 18 38
e-mail: PatentAttorneys.GHZ@t-online.de
Internet: <http://www.berlin-patent.net>

5

Unser Zeich/our reference
P104200DE-Goe
Datum/date
Berlin, 30.11.2000

10

15

Verfahren zur Messung von Kennwerten, insbesondere der Temperatur eines mehrschichtigen Materials während des Schichtenaufbaus

20

25

10 Verfahren zur Messung von Kennwerten, insbesondere der Temperatur eines mehrschichtigen Materials während des Schichtenaufbaus

Beschreibung

20 Die Erfindung betrifft ein Verfahren zur Messung von Kennwerten, insbesondere der Temperatur eines mehrschichtigen Materials während des Schichtenaufbaus, insbesondere eines Halbleiterschichtsystems während der Epitaxie, bei konstanten Prozeßbedingungen. Das Verfahren kann in-situ bei der 25 metallorganischen Gasphasenepitaxie (MOVPE), Molekularstrahlepitaxie (MBE) oder ähnlicher Verfahren angewandt werden und ermöglicht die Bestimmung der Probentemperatur unter Standardwachstumsbedingungen.

30 Die genaue Kenntnis der Temperatur ist für das Wachstum von Halbleiterschichtsystemen und Halbleiterbauelementen extrem wichtig, da praktisch alle wesentlichen Wachstumsparameter wie z.B. Wachstumsrate, Zusammensetzung, Dotierungseinbau 35 temperaturabhängig sind. Natürlich können diese Kennwerte nach Ende des Wachstumsprozesses bestimmt werden. Zur Einflußnahme auf den Wachstumsprozeß und zur Übertragbarkeit der Prozeßbedingungen auf andere Anlagen ist jedoch die aktuelle Kenntnis der Temperatur unerlässlich.

40 Die Probentemperatur hängt wesentlich von äußeren Parametern (Belegung der Reaktorwände, Art des Trägergases, Form und

5 Größe des Probenträgers, dessen Rotationsgeschwindigkeit
etc.) ab. Daher muß in der Praxis häufig eine Temperaturka-
librierung der Temperaturmeßeinrichtung durchgeführt werden
(die alte Kalibrierung verliert bei Veränderung eines Para-
meters ihre Gültigkeit). Ein herkömmliches Verfahren zur
10 Temperaturkalibrierung verwendet spezielle Kalibrierproben,
z. B. Eutektika oder Schmelzproben. Diese Kalibrierung kann
dann nur bei einer festen, durch den Schmelzpunkt oder Um-
schlagpunkt des Materials vorgegebenen Temperatur erfolgen.
Ein Temperaturvergleich zwischen verschiedenen Reaktoren, z.
15 B. zum Übertragen von Prozessen von einer Anlage auf die
nächste, ist daher nur bei dieser einen Temperatur möglich.
In der Regel liegt die eigentliche Wachstumstemperatur nicht
bei dieser Umschlagtemperatur und das Verfahren ist daher
20 zum Abgleich der eigentlichen Wachstumstemperatur nur be-
dingt geeignet und daher problematisch. Die Kalibrierung ist
außerdem sehr zeitaufwendig.

25 zur Temperaturmessung in einer MBE- oder MOVPE-Anlage sind
im wesentlichen zwei Verfahren bekannt:

1. Messung mit Thermoelementen:

Im Probenträger (Suszeptor, i.d.R. aus Graphit gefertigt)
auf dem die Probe liegt, befindet sich ein Thermoelement.
Die vom Thermoelement gemessene Temperatur entspricht nur
30 dann der wahren Probentemperatur, wenn die Probe mit dem
Suszeptor im thermischen Gleichgewicht steht. Dies ist im
Realfall nicht unbedingt der Fall. Moderne, kommerzielle
Epitaxiesysteme verfügen i.d.R. über rotierende Proben. Bei
der MOVPE ist der Suszeptor dabei oft mehrteilig. Im Haupt-
suszeptor befindet sich ein zusätzlicher Teller der durch
35 einen Gasstrom gedreht und getragen wird. Durch diese Kon-
struktion ist der thermische Kontakt zwischen geheiztem Sus-
zeptor (mit Thermoelement) und Probe stark herabgesetzt. Zu-

5 sätzliche Effekte wie z.B. Kühlung durch den Gasstrom, ver-
änderte Abstrahlung oder Ausbildung eines Strahlungsgleich-
gewichtes im Reaktor durch Belegung der Innenwände können zu
weiteren Abweichungen führen. Genaue Form, Größe und Bele-
gung des Suszeptors und des Reaktors haben einen Einfluß auf
10 die Größe der Abweichung der Probentemperatur von der Ther-
moelementtemperatur.

15 Mit Thermoelementen kann in jedem Fall nur die Temperatur
des Suszeptors gemessen werden. Die wahre Temperatur der
Probe kann davon abweichen, z.B. aufgrund veränderter Ab-
strahlung oder Ausbildung eines Strahlungsgleichgewichtes im
reaktor oder eines schlechten thermischen Kontaktes.

2. Messung mit Pyrometern:

20 Große Multi-Wafer-Anlagen arbeiten mitunter mit planetari-
scher Rotation, das heißt, mehrere Probenträger drehen sich
auf einem Teller um eine Achse und außerdem um sich selbst.
Da sich hier Thermoelemente nicht einsetzen lassen, wird die
Temperatur mittels Pyrometrie gemessen. Dabei wird die ther-
25 mische Emission von infrarotem Licht der Probe detektiert.
Das Verfahren setzt eine genaue Kenntnis der Emissivität des
gemessenen Materials voraus, um aus der Messung die Tempe-
ratur fehlerfrei bestimmen zu können. Außerdem ist Pyrometrie
nur in einem eingeschränkten Temperaturbereich verwendbar
30 (ab ca. 300°C).

Um die Thermoelement- bzw. Pyrometertemperatur auf die wahre
Probentemperatur zu kalibrieren, werden, wie oben bereits
beschrieben, Schmelzpunktbestimmungen oder Eutektikumska-
35 librierungen benutzt. Dabei werden spezielle Substanzen mit
genau bekannten Schmelz- oder Umschlagpunkten im Epitaxie-
system erhitzt und die Temperaturdifferenz bestimmt. Dies
kann nur in einem separaten Wachstums-Lauf erfolgen, da spe-

5 zielle, für das Wachstum nicht taugliche Proben benutzt werden müssen. Außerdem entsprechen nicht alle Bedingungen im Reaktor den realen Wachstumsbedingungen.

10 Es ist aus der US-A 5.403.433 außerdem bekannt, Reflexionsdaten zur Temperaturbestimmung heranzuziehen. Dabei wird die Lage der kritischen Punkte eines Halbleiters vermessen, indem die temperaturabhängige Verschiebung der fundamentalen Bandkante bestimmt wird. Letztere kann durch Messung des Streulichtes von der Probenrückseite bestimmt werden, da das 15 Streulicht nur dann messbar ist, wenn die Probe für die verwendete Lichtwellenlänge durchsichtig wird. Nachteil ist, daß eine Transmissionsmessung aufwendig und in-situ kaum machbar ist. Außerdem ist die sehr genaue Kenntnis der optischen Eigenschaften des verwendeten Materials (Temperaturabhängigkeit der dielektrischen Funktion bzw. des Brechungsin-20 dex und der Absorptionskonstante) nötig.

25 Der Erfindung liegt die Aufgabe zugrunde, ein Verfahren der eingangs genannten Art anzugeben, das die in-situ-Messung der Temperatur einer Probe bei wesentlich verringertem Auf-
wand erlaubt.

30 Erfindungsgemäß wird die Aufgabe gelöst durch die Merkmale im kennzeichnenden Teil des Anspruchs 1 im Zusammenwirken mit den Merkmalen im Oberbegriff. Zweckmäßige Ausgestaltungen der Erfindung sind Gegenstand der Unteransprüche.

35 Danach wird das Material mit einer konstanten Beleuchtungsenergie beleuchtet, seine Reflektivität über der Zeit gemessen und daraus die Lage eines Extremwertes der Fabry-Perot-Oszillationen der jeweiligen Schicht bestimmt, aus der die Schicht-Wachstumsrate und anhand vorermittelter Vergleichswerte die Prozeßtemperatur und/oder die Schichtzusammenset-

5 zung ermittelt wird. In der folgenden Beschreibung wird aus Gründen der einfacheren Darstellung davon ausgegangen, daß als Extremwert das erste Minimum verwendet wird, das sich meßtechnisch am schnellsten und leichtesten auswerten läßt. Genauso gut könnte jedoch ein anderer Extremwert verwertet
10 werden.

15 Es wurde gefunden, daß sich durch Messung der Reflektivität einer Probe nach Bestimmung des ersten Minimums der Fabry-Perot-Oszillation direkt auf die Temperatur der Probe und auf weitere Kennwerte schließen läßt, wenn die Photonenergie während des Vorgangs, bei dem die Messung erfolgen soll, konstant gehalten wird.

20 Die meisten Epitaxieanlagen können mit einem optisch transparenten Fenster ausgestattet werden, so daß optische Messungen unter senkrechttem Einfall erfolgen können. Mittels optischer Verfahren kann die Reflektivität der Probe gemessen werden. Genauer gesagt, eine Meßgröße DC (Spannung eines Detektors) ist der Reflektivität einer Probe sowie Einfluß-
25 faktoren der Meßanordnung proportional:
DC = Reflektivität * Apparatefunktion.

30 Die Apparatefunktion kann durch geeignetes Normieren des Meßsignals eliminiert werden, so daß die Reflektivität als solche bestimmt werden kann. Da auch der Bezugsmesswert nicht als absolute Größe bekannt sein muß, reicht die Messung der auf ein Ausgangsmaterial bezogenen Reflektivität.

35 Das vorgestellte Verfahren basiert somit auf der Messung einer Detektorspannung DC bei einer festen Photonenergie im IR-, visuellen oder UV-Spektralbereich und der Bestimmung eines ersten Minimums der Detektorspannung (Transientenmes-

5 sung) während des Wachstums eines definierten Schichtensta-
pels.

10 Um während des Wachstums des Schichtenstapels die Material-
qualität zu überwachen, können vor und nach dem Wachstum
RAS-Spektren (Reflexions-Anisotropie-Spektroskopie) gemessen
werden. Zusätzlich kann ein RAS-Signal auch während des
Wachstums parallel zur DC-Transiente gemessen werden. Auf-
grund der hohen Oberflächensensitivität der RAS kann so eine
Degradation der Schicht frühzeitig angezeigt werden.

15 wird bei dem zum Stand der Technik oben beschriebenen Ver-
fahren die Temperaturabhängigkeit der dielektrischen Funkti-
on ausgenutzt, indem bei bekannter Temperaturabhängigkeit
des Brechungsindex aus dem gemessenen Brechungsindex eine
20 Temperatur abgeleitet wird, ist immer eine Datenbankauswer-
tung notwendig, bei der der Wert des Brechungsindex für das
benutzte Material mit der Temperatur verknüpft wird. Damit
geht eine etwaige Ungenauigkeit in der Datenbank voll in die
Temperaturmessung ein. Um den Brechungsindex überhaupt aus
25 der gemessenen Kurve bestimmen zu können, ist in jedem Fall
eine Simulation (Rechnung) der Messung mit Fit notwendig.

30 Nach dem vorliegenden Verfahren werden dagegen zum Vergleich
von Temperaturen und zur Kalibrierung direkt gemessene Roh-
daten, nämlich der Reflektivitätswert des ersten Minimums
der Fabry-Perot-Oszillationen genutzt. Damit geht beim Rela-
tivvergleich von Temperaturen, z. B. zwischen verschiedenen
Anlagen, keine Datenbank ein und es ist keine Rechnung oder
Simulation notwendig. Natürlich kann durch einen zusätzli-
35 chen Datenbank-Fit die Meßgenauigkeit weiter erhöht werden.
Erst wenn dem gemessenen Reflektivitätswert des Minimums ei-
ne absolute Temperatur zugeordnet werden soll, ist eine
Kalibrierkurve zum Ablesen des Temperaturwertes nötig. Aber

5 auch hierfür wird keine Datenbank für den Brechungsindex benötigt.

10 Die Erfindung soll nachstehend anhand eines Ausführungsbeispiels näher erläutert werden. In den zugehörigen Zeichnungen zeigen

Fig. 1 eine an sich bekannte Anordnung zur kombinierten Reflexions- und RAS-Messung einer Probe,

15 Fig. 2 die Temperaturabhängigkeit des Realteils der dielektrischen Funktion für GaAs und AlAs,

Fig. 3 den Zusammenhang zwischen den Fabry-Perot-Oszillationen und der Temperatur,

20 Fig. 4 eine aus Datenbankspektren errechnete Kalibrierkurve für die Reflektivität in Abhängigkeit von der Temperatur,

25 Fig. 5 eine gemessene Kalibrierkurve für die Reflektivität in Abhängigkeit von der Temperatur,

Fig. 6 die Anwendung des Verfahrens für eine Kalibrierung von MOVPE-Reaktoren,

30 Fig. 7 den Zusammenhang zwischen den Fabry-Perot-Oszillationen und der Wachstumsrate bei der Epitaxie anhand einer Modellrechnung,

35 Fig. 8 den gemessenen und mit Datenbankwerten gefütteten Verlauf der Reflektivität bei einer bestimmten Temperatur,

5 Fig. 9 die Reflektivitäts-Transiente beim Wachsen eines
ternären Materials,

Fig. 10 eine sich daraus ergebende Kalibrierkurve für den
Al-Gehalts des ternären Materials und

10 Fig. 11 die Reflektivitäts-Transiente bei der Epitaxie ei-
nes 5-Schichten-Stapels.

15 Fig. 1 zeigt eine Anordnung zur kombinierten Reflexions- und
RAS-Messung einer Probe in einer MOVPE-Anlage. Das Licht ei-
ner Xenonlampe 1 wird über ein Polarisationsprisma 2 und ei-
nen Strahlteiler 3 auf einen rotierenden Probenhalter 4 mit
einer Probe 5 fokussiert. Ein erster Spiegel 6 dient zur Fo-
kussierung des Lichts auf die Probe 5. Von der Probe 5 wird
20 das Licht auf einen sphärischen Spiegel 7 reflektiert. Der
sphärische Spiegel 7 hat eine kompensierende Funktion bezüg-
lich der Taumelbewegung, die der rotierende Probenträger 4
ausführt. Das Licht läuft dann in sich zurück zum Strahltei-
ler 3. Mittels eines Photoelastischen Modulators 8 kann das
25 Licht moduliert und über ein weiteres Polarisationsprisma 9
abgefragt werden. Über weitere Spiegel 10, 11 wird das Licht
auf einen Monochromator 12 fokussiert und mittels eines Si-
lizium-Dioden-Detektors 13 detektiert.

30 Der Probenträger 4 befindet sich dabei in einem MOVPE-
Reaktor 14, wobei das Licht durch ein optisches Fenster 15
auf die Probe 5 gelangt.

35 Der am Anfang und gegebenenfalls auch am Ende an Hand der
Detektorspannung DC gemessene Buffer (Material A) erlaubt
eine Normierung der gemessenen Transiente, was zur Eliminie-
rung der Apparatefunktion führt:

$$DC/DC_{\text{Material A}} = R/R_{\text{Material A}}$$

5

Die Apparatefunktion enthält alle Anteile des Meßsignals, die nicht von der Probe, sondern nur vom verwendeten optischen System abhängen; z.B. ist das die Intensitätsverteilung der Xenonlampe 1, die spektrale Empfindlichkeit des Detektors 13 etc.

10

Die Reflektivität der Probe 5 hängt von den optischen Eigenschaften (dielektrische Funktion ϵ_1 , ϵ_2 bzw. Brechungsindex n und Absorption k) ab, die temperaturabhängig sind. Beim Wachstum beobachtet man aufgrund des Brechungsindexunterschiedes und der sich einstellenden Vielstrahlinterferenz an der Probenoberfläche die bekannten Fabry-Perot-Oszillationen.

15

Es wurde nun gefunden, daß die Tiefe des ersten Minimums der Fabry-Perot-Oszillationen während des Wachstums von Material B direkt als Maß für die Temperatur genutzt werden kann, wenn die Reflektivität an einer geeigneten, konstant gehaltenen Photonenergie gemessen wird. Die Tiefe dieses Minimums hängt nur von der Temperatur ab und nicht von anderen Parametern wie z.B. der Wachstumsrate. Das Minimum stellt sich bei dem Wachstumsprozeß je nach der angestrebten Wachstumsrate innerhalb weniger Sekunden oder Minuten ein.

20

Um auf diese einfache Weise die Temperaturabhängigkeit der dielektrischen Funktion zu messen, muß die Photonenergie geeignet gewählt werden. Fig. 2 zeigt als Beispiel die Temperaturabhängigkeit des Realteils der dielektrischen Funktion für GaAs und AlAs. Für das Verfahren wird zweckmäßig eine energetische Position verwendet, bei der die Temperaturempfindlichkeit des einen Materials groß ist, während die des anderen Materials klein ist. Zusätzlich sollte bei dieser Energie im betrachteten Temperaturbereich kein kritischer

25

5 Punkt liegen, sondern ein monotoner Bereich. Dadurch, daß
 bei GaAs und AlAs die jeweiligen kritischen Punkte weit ge-
 trennt liegen, läßt sich ein Energiebereich finden, in dem
 diese Forderungen gut erfüllt sind: $E = 2.6 \dots 3.1 \text{ ev}$ (ge-
 stricherter Bereich). In diesem Bereich gilt: $R = R(\epsilon_1)$ (da
 10 AlAs fast absorptionsfrei ist) und $\epsilon_1(\text{AlAs}) \approx \text{const}$, somit
 ist die Temperaturabhängigkeit von GaAs über $\epsilon_1(\text{GaAs})$ direkt
 als $\epsilon_1(T)$ meßbar.

Fig. 3 zeigt die Abhängigkeit des ersten Minimums der Fabry-
 15 Perot-Oszillationen von der Temperatur anhand eines Schich-
 tenstapels, wobei für das Verfahren folgendes Materialsystem
 gewählt wurde:

Material A (Substrat) = Galliumarsenid (GaAs)
 20 Material B (erste Schicht) = Aluminiumarsenid (AlAs), 50 nm
 Material A (zweite Schicht) = Galliumarsenid (GaAs), 200 nm

Die Lage des Minimums verschiebt sich, wobei sich auch des-
 sen Tiefe verändert. Die Darstellung zeigt, daß der Wert des
 25 Reflexionsparameters R/R_{GaAs} an der Stelle des Minimums als
 ein Maß für die aktuelle Temperatur herangezogen werden
 kann.

Da der gemessene Relativwert des Reflexionsparameters
 30 $R_{\text{schicht}}/R_{\text{GaAs}}$ an der Stelle des Minimums ein Maß für die Tempe-
 ratur ist, kann für Relativvergleiche zwischen verschiedenen
 Wachstumsanlagen diese Größe sofort herangezogen werden, oh-
 ne daß Absolutwerte der Reflektivität bekannt sein müssen.
 Für die Messung einer absoluten Temperatur muß entweder eine
 35 genaue Datenbank der dielektrischen Funktionen der beiden
 verwendeten Materialien A und B zur Verfügung stehen (Er-
 stellung solch einer Datenbank über in-situ Messungen mit

5 spektroskopischer Ellipsometrie oder mit Reflexionsmessungen
wie hier vorgestellt) oder ein Kalibrierpunkt mittels Eutek-
tikumseichung erzeugt werden. Die so erhaltene Kalibrierkur-
ve ist dann universell an jeder Epitaxieanlage gültig.

10 In Fig. 4 ist eine solche, aus Datenbankspektren berechnete
Kalibrierkurve aufgetragen.

15 In Fig. 5 ist eine sich aus den Messungen der Minima bei
verschiedenen Temperaturen ergebende Kalibrierkurve eben-
falls für eine Photonenenergie von $E = 2,65$ eV dargestellt.
Gezeigt ist der für die III-V-Epitaxie interessante Tempe-
turbereich.

20 Mit einer solchen Kalibrierkurve ist es dann möglich, andere
vorhandene Temperaturmeßeinrichtungen, wie sie eingangs be-
schrieben wurden, zu kalibrieren.

25 Fig. 6 zeigt eine solche Kalibrierung verschiedener Anlagen.
Eingetragen sind Meßwerte von drei verschiedenen MOVPE-
Anlagen mit rotierender und nichtrotierender Probe. Die Pro-
bentemperatur wird mittels Thermoelementen gemessen. Die no-
minellen, von den Thermoelementen angezeigten Temperaturen
der rotierenden Proben (gestrichelte Geraden) weichen deut-
lich voneinander und von der der nichtrotierenden Probe ab.
30 Die Messung der nichtrotierenden Probe zeigt hinreichend ge-
nau die wahre Temperatur. Aus der Forderung, daß die Kurven
alle deckungsgleich sein sollen, kann die Temperaturabwei-
chung für jeden Reaktor bestimmt werden.

35 Fig. 7 zeigt die Verschiebung der ersten Minima der Fabry-
Perot-Oszillationen bei einer konstanten Temperatur und ver-
schiedenen Wachstumsraten. Erkennbar ist, daß die Minima
gleich tief sind, sich jedoch mit sinkender Wachstumsrate

5. auf der Zeitachse verschieben. Bei ansonsten gleichbleibenden Bedingungen kann deshalb auch die Wachstumsrate der Schichten aus der gemessenen Transiente bestimmt werden.

10 Hierfür werden Transienten für mehrere Wachstumsraten ermittelt, von denen eine in Fig. 8 gezeigt ist. Zur präziseren Auswertung der gemessenen Reflexionstransienten kann der Kurvenverlauf mittels Datenbanken simuliert werden und die entsprechenden Parameter (Brechungsindex n , Absorption k , Wachstumsraten r_1 , r_2) angepaßt/gefittet werden. Dies erlaubt 15 entweder eine sehr genaue, vom Rauschen der einzelnen Meßpunkte im Minimum entkoppelte Bestimmung der Tiefe des Minimums oder alternativ bei bekannter Temperatur die Erstellung/Verbesserung einer Datenbank für diese Werte, die als solche später zum Vergleich mit gemessenen Kurven dienen 20 kann.

Durch Erweiterung des Schichtenstapels um zwei weitere Schichten kann mit dem Verfahren im gleichen Run neben der Temperatur auch die Komposition eines ternären Materials 25 nebst der zugehörigen Wachstumsrate gemessen werden. Der Schichtenstapel wird dann beispielsweise wie folgt gewählt: Material A - ca. 50 nm Material B - ca. 200 nm Material A - ca. 50 nm ternäres Material C - ca. 200 nm Material A.

30 Aus den ersten drei Schichten wird wie oben erläutert die Temperatur sowie die Wachstumsraten von Material A und B bestimmt. Mit der nun bekannten Temperatur ist es möglich, aus den letzten beiden Schichten die Zusammensetzung abhängigkeit der dielektrischen Funktion von Material C von der Temperaturabhängigkeit zu trennen, wenn zuvor eine Kalibrierkurve für die Zusammensetzung des ternären Materials C ermittelt wurde. Damit kann die Tiefe des ersten Minimums der 35 Fabry-Perot-Oszillationen des ternären Materials C direkt

5 als Maß für die Zusammensetzung von Material C benutzt werden. Denn genau wie die Temperatur verändert die Zusammensetzung den Brechungsindex und damit die dielektrische Funktion. Durch die geschickte Wahl des Schichtenstapels und den zweistufigen Meßprozeß, können beide Effekte sauber getrennt werden.

10 Die Fig. 9 bis 11 zeigen die Anwendung dieser Methode für $Al_xGa_{1-x}As$. Gemäß Fig. 9 wird die Transiente für das ternäre Material C $Al_xGa_{1-x}As$ gemessen. Aus den Minima der ersten 15 Fabry-Perot-Oszillation lässt sich eine Kalibrierkurve in Abhängigkeit vom Al-Gehalt ermitteln, wie Fig. 10 zeigt. Fig. 11 zeigt eine Simulation einer kompletten Messung zur Bestimmung von Wachstumsrate (r), Temperatur (T) und Aluminium-Gehalt (x) in einem Run.

20 Der besondere Vorteil des Verfahrens ist die einfache Entkopplung von den Effekten, die durch Wachstumsratenänderung verursacht werden, von denen, die durch Temperaturveränderung verursacht werden. Nur durch die geschickte Wahl des 25 Schichtenstapels und die Messung bei einer geeigneten Photonenenergie können Wachstumsrate und Temperatur aus einer Transiente eindeutig bestimmt werden. Damit ist auch der Vergleich von Temperaturen zwischen verschiedenen Wachstumsanlagen möglich.

30 Die Messung kann insbesondere dann als verlässlich gelten, wenn vor und nach dem Wachstum eines A-B-A-Schichtenstapels der Wert der Reflektivität gleich groß ist. Dies ist der Grund, warum in der Schichtstruktur vor und nach der Schicht B zweckmäßig eine Schicht A gewachsen wird.

35 Durch Degradation der Schichten könnte eine fehlerhafte Temperaturinformation gemessen werden. Jedoch bietet ein

5 gleichzeitig gemessenes RAS-Signal ein "Frühwarnsystem", da
sich Degradationen im RAS-Signal deutlich früher zeigen, als
in der Reflektivität der Probe.

10 Der Temperaturbereich, in dem das Verfahren angewandt werden
kann, ist praktisch nicht beschränkt, sofern mit einer ge-
eigneten Photonenergie gearbeitet wird, und solange für
das benutzte Material einkristallines Wachstum (Epitaxie)
möglich ist.

15 Es ist sicherzustellen, daß die Messungen immer bei der ex-
akt gleichen Photonenergie erfolgen. Bei Verwendung einer
Xenon-Hochdrucklampe als Lichtquelle für das Reflektometer
kann die Lage der Emissionslinie bei $E=2.65\text{eV}$ ausgenutzt
werden. Die spektrale Lage der Linie hängt von praktisch
20 keinen äußeren Parametern ab und kann daher auch probenunab-
hängig genau angefahren werden.

25 Die Genauigkeit des Verfahrens hängt dann im wesentlichen
nur vom Signal-Rausch-Verhältnis des für die Reflexionsmes-
sung verwendeten Spektrometers ab. Für das gezeigte Beispiel
erlaubte das Signal-Rausch-Verhältnis des optischen Systems
eine Meßgenauigkeit von $\pm 5\text{K}$.

30 Das Verfahren kann vor jedem Epitaxieablauf zur präzisen
Temperaturkalibrierung eines Thermoelements oder Pyrometers
eingesetzt werden (Zeitaufwand kleiner 1h). Die erreichbare
Genauigkeit der Temperaturmessung für vergleichende Messun-
gen beträgt mindestens $\pm 5\text{K}$. Damit ist ein Kalibrieren der
Reaktortemperatur für die tatsächlich vorhandene Suszep-
35 tor/Reaktorkonfiguration möglich.

5 Bei horizontalen Ein-Wafer-Reaktoren hängt die wahre Proben-
temperatur auch vom Belegungszustand des Liner-Rohres ab
(Temperaturdifferenz $\geq 10K$), während das Thermoelement kon-
stante Temperatur anzeigt. Diese sonst nicht meßbare Tempe-
raturdifferenz kann mittels des vorgestellten Verfahrens ge-
10 messen werden.

Bezugszeichenliste

- 1 Xenonlampe
- 2 Polarisationsprisma
- 3 Strahlteiler
- 10 4 Probenhalter
- 5 Probe
- 6 Spiegel
- 7 Sphärischer Spiegel
- 8 Modulator
- 15 9 Polarisationsprisma
- 10 Spiegel
- 11 Spiegel
- 12 Monochromator
- 13 Silizium-dioden-Detektor
- 20 14 MOVPE-Reaktor
- 15 Optisches Fenster
- T Temperatur
- r Wachstumsrate
- x Aluminiumgehalt

Patentansprüche

10 1. Verfahren zur Messung von Kennwerten, insbesondere der Temperatur eines mehrschichtigen Materials während des Schichtenaufbaus, insbesondere eines Halbleiterschichtsystems während der Epitaxie, bei konstanten Prozeßbedingungen,

15 dadurch gekennzeichnet, daß das Material mit einer konstanten Beleuchtungsenergie beleuchtet, seine Reflektivität über der Zeit gemessen und daraus die Lage eines Extremwertes der Fabry-Perot-Oszillationen der jeweiligen Schicht bestimmt wird, aus der die Schicht-Wachstumsrate und anhand vorermittelter Vergleichswerte die Prozeßtemperatur und/oder die Schichtzusammensetzung ermittelt wird.

25 2. Verfahren nach Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet, daß als Extremwert das erste Minimum der Fabry-Perot-Oszillationen verwertet wird.

30 3. Verfahren nach Anspruch 1 oder 2, gekennzeichnet dadurch, daß die aktuell gemessene Reflektivität zur Reflektivität eines Referenzmaterials, auf dem mindestens eine Schicht aufgebaut wird, ins Verhältnis gesetzt wird.

4. Verfahren nach einem der vorhergehenden Ansprüche,

5 gekennzeichnet dadurch, daß am Ende eines Prozeßschrittes oder des gesamten Prozesses eine Schicht aus dem gleichen Material wie ein Substratmaterial, auf dem mindestens eine Schicht aufgebaut wird, gewachsen und dessen Kennwerte mit den zu Beginn des Prozesses vorliegenden Kennwerten verglichen werden.

10

15 5. Verfahren nach einem der vorhergehenden Ansprüche, gekennzeichnet dadurch, daß die Materialeigenschaften während des Prozesses zeitparallel, mindestens aber vor Prozeßbeginn und nach Prozeßende durch eine RAS-Messung überwacht werden.

20 6. Verfahren nach einem der vorhergehenden Ansprüche, gekennzeichnet dadurch, daß die Reflektivität bei dem betrachteten Extremwert der Fabry-Perot-Oszillationen zur Bestimmung der Prozeßtemperatur herangezogen wird.

25

30 7. Verfahren nach einem der vorhergehenden Ansprüche, gekennzeichnet dadurch, daß die Prozeßzeit bis zum betrachteten Extremwert der Fabry-Perot-Oszillationen zur Bestimmung der Schichtwachstumsrate herangezogen wird.

35 8. Verfahren nach einem der vorhergehenden Ansprüche, gekennzeichnet dadurch, daß bei zuvor ermittelter Prozeßtemperatur die Reflektivität beim betrachteten Extremwert der Fabry-Perot-

5 Oszillationen einer ternären Schicht zur Bestimmung von
deren Zusammensetzung herangezogen wird.

10 9. Verfahren nach einem der vorhergehenden Ansprüche,
gekennzeichnet dadurch, daß
die Beleuchtungsenergie in einem Bereich gewählt wird,
in dem die Temperaturabhängigkeit des Realteils der die-
lektrischen Funktion der beteiligten Materialien monoton
ist.

Zusammenfassung

Verfahren zur Messung von Kennwerten, insbesondere der Temperatur eines mehrschichtigen Materials während des Schichtenaufbaus

Die Erfindung bezieht sich auf ein Verfahren zur Messung von Kennwerten, insbesondere der Temperatur eines mehrschichtigen Materials während des Schichtenaufbaus, insbesondere eines Halbleiterschichtsystems während der Epitaxie, bei konstanten Prozeßbedingungen.

Bisher bekannte Verfahren unter Verwendung von Thermoelementen oder Pyrometern sind ungenau. Andere verlangen die genaue Kenntnis der optischen Eigenschaften des verwendeten Materials.

Nach dem Verfahren wird das Material mit einer konstanten Beleuchtungsenergie beleuchtet, seine Reflektivität über der Zeit gemessen und daraus die Lage eines Extremwertes der Fabry-Perot-Oszillationen der jeweiligen Schicht bestimmt, aus der die Schicht-Wachstumsrate und anhand vorermittelter Vergleichswerte die Prozeßtemperatur und/oder die Schichtzusammensetzung ermittelt wird.

Das Verfahren kann in-situ bei der metallorganischen Gasphasenepitaxie (MOVPE), Molekularstrahlepitaxie (MBE) oder ähnlicher Verfahren angewandt werden und ermöglicht die Bestimmung der Probentemperatur unter Standardwachstumsbedingungen.

Fig. 3

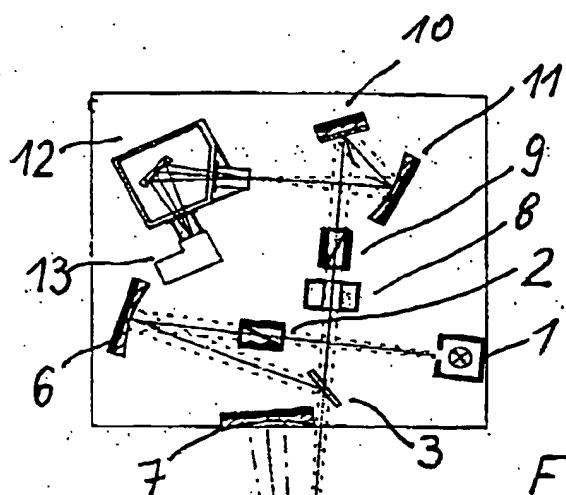


Fig. 1

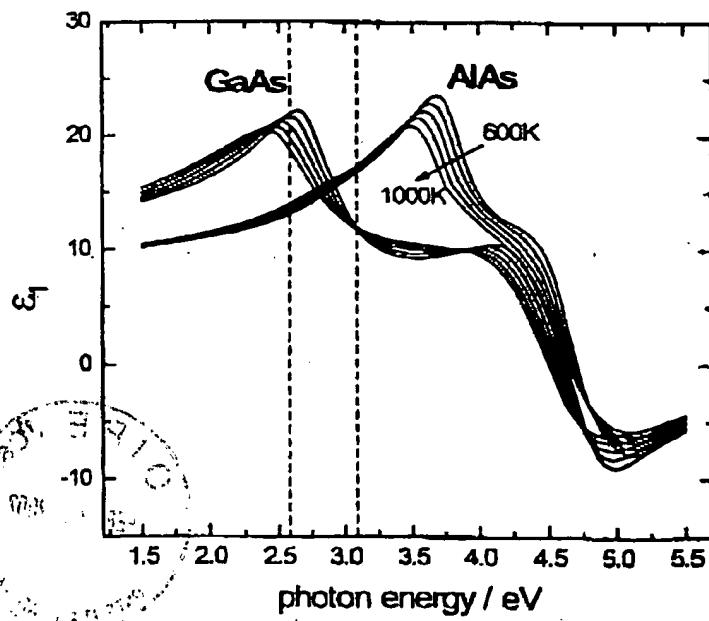
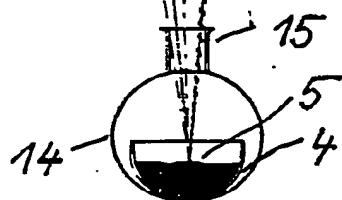


Fig. 2

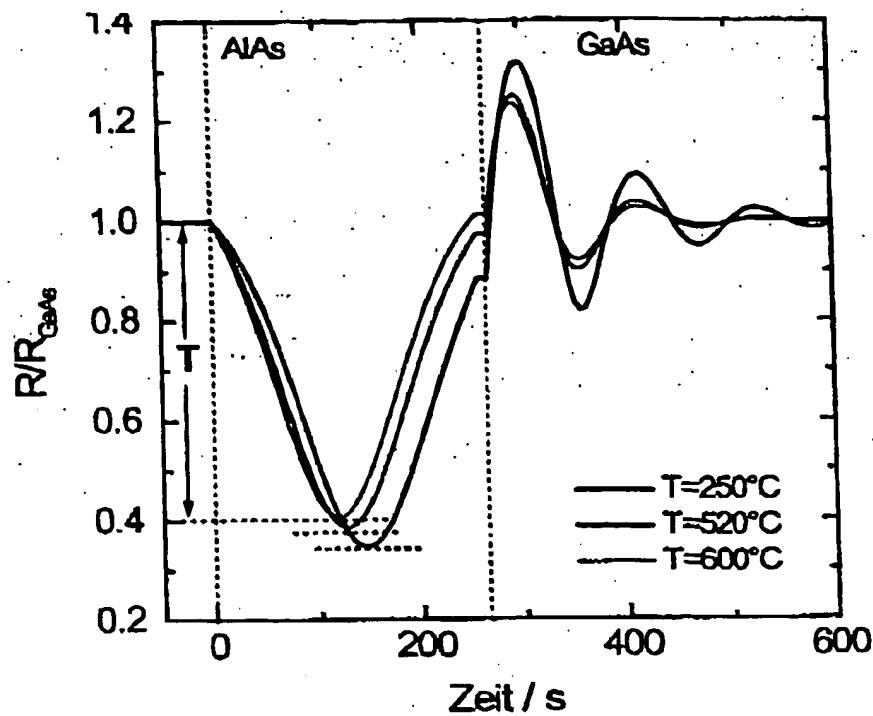


Fig. 3

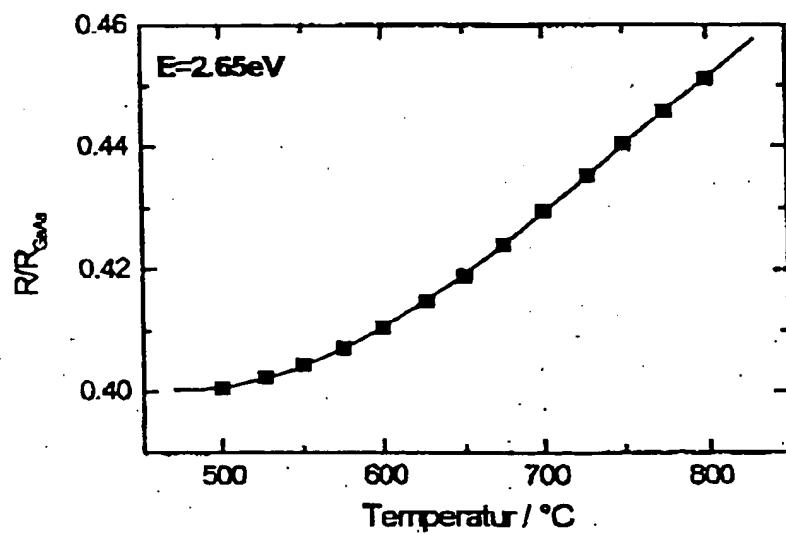


Fig. 4

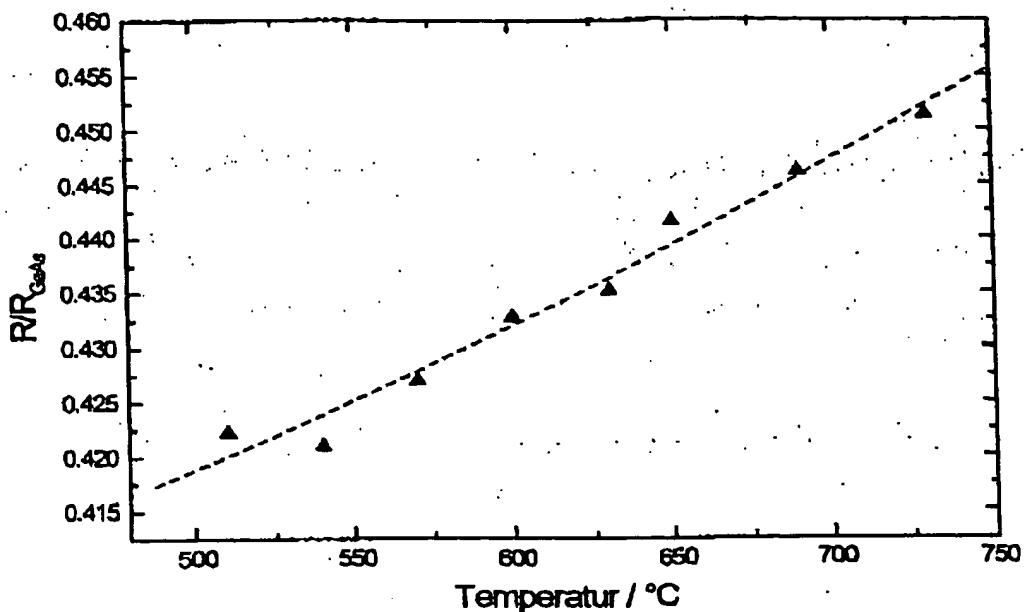


Fig. 5

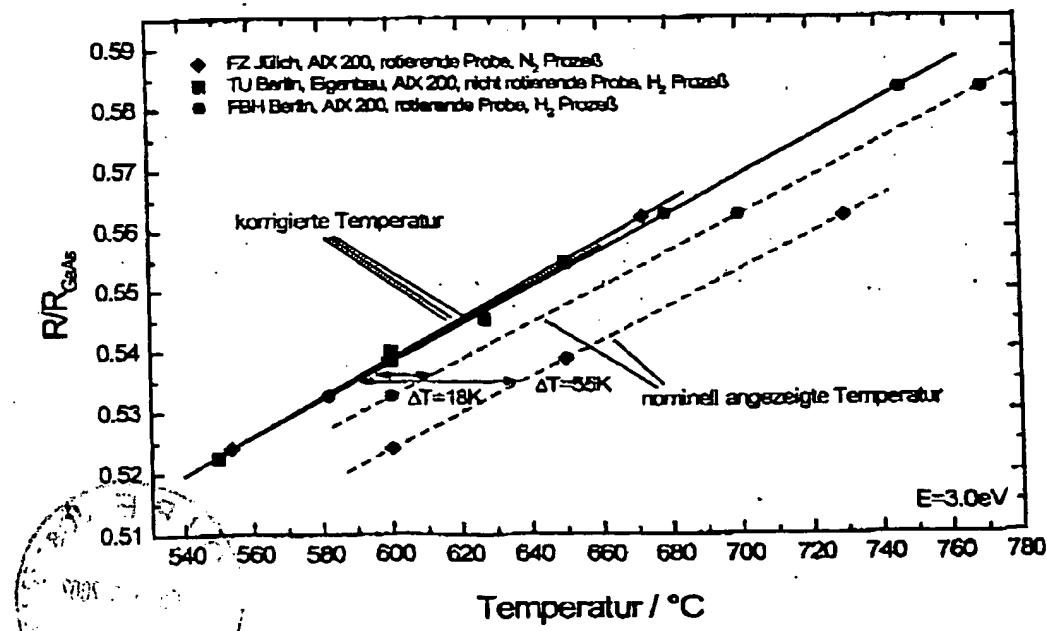


Fig. 6

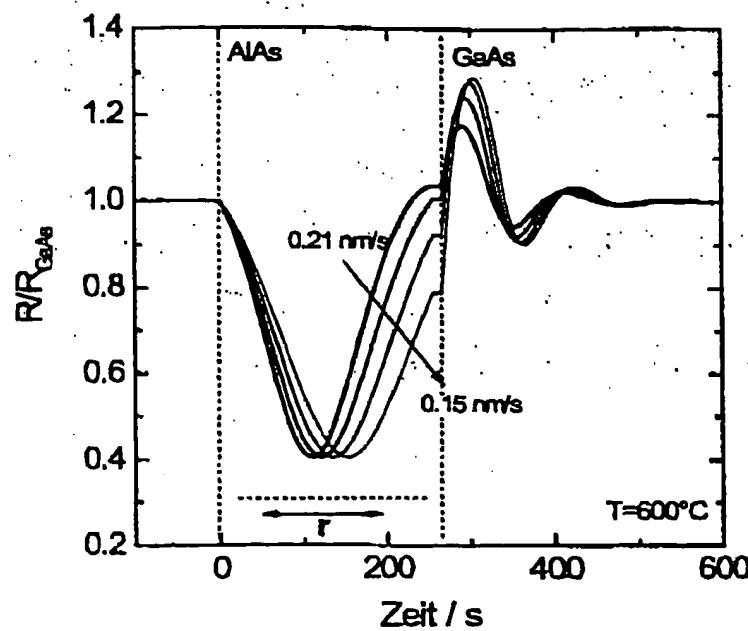


Fig. 7

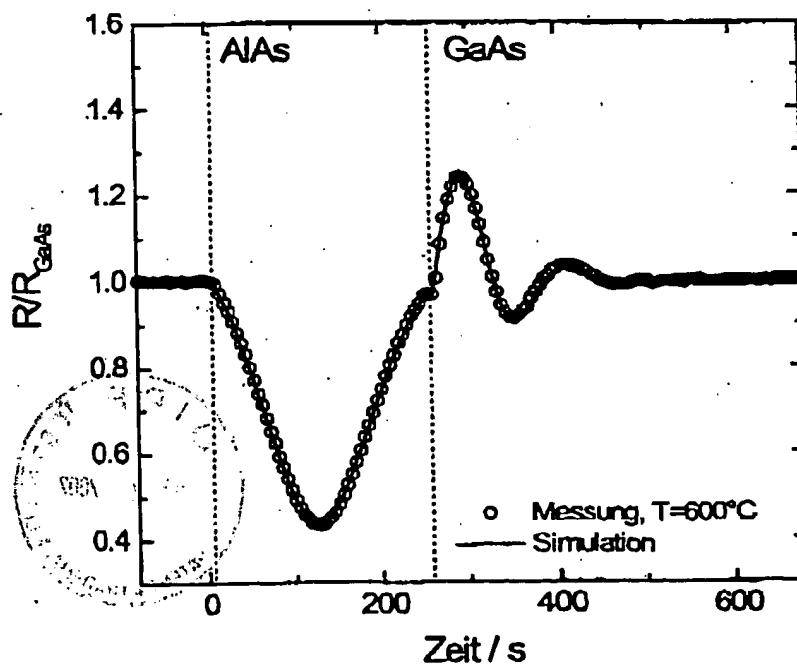


Fig. 8

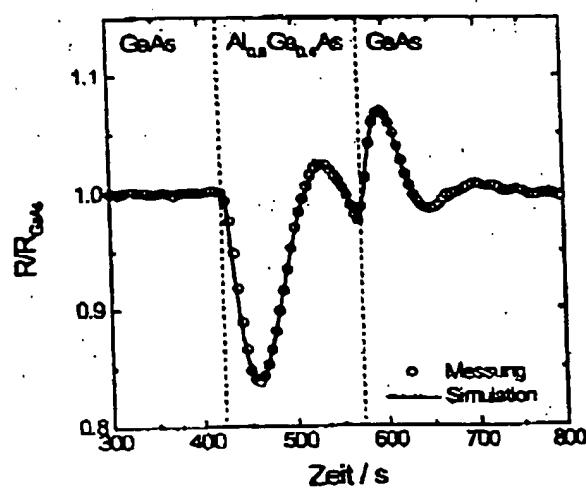


Fig. 9

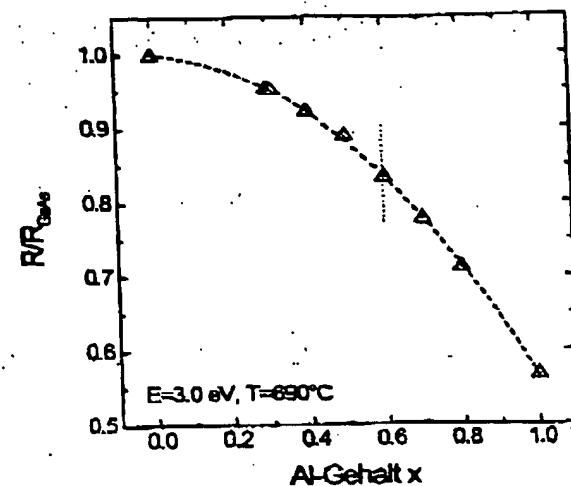


Fig. 10

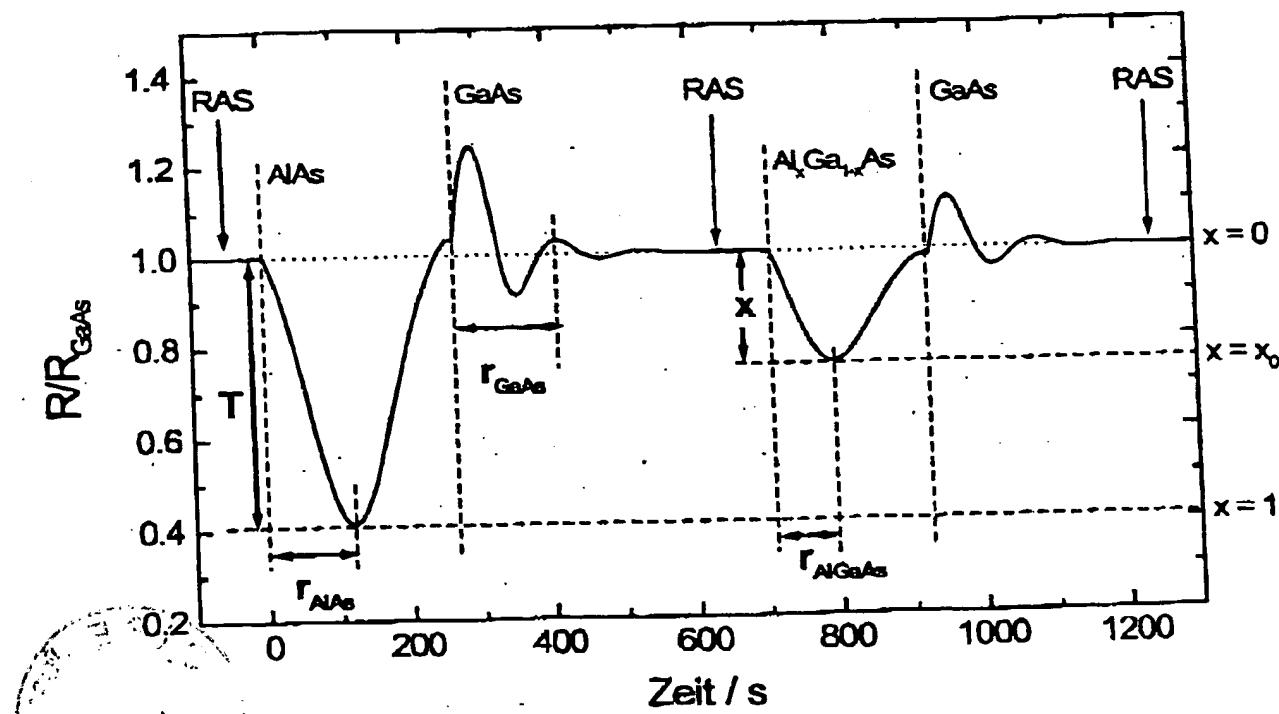


Fig
11